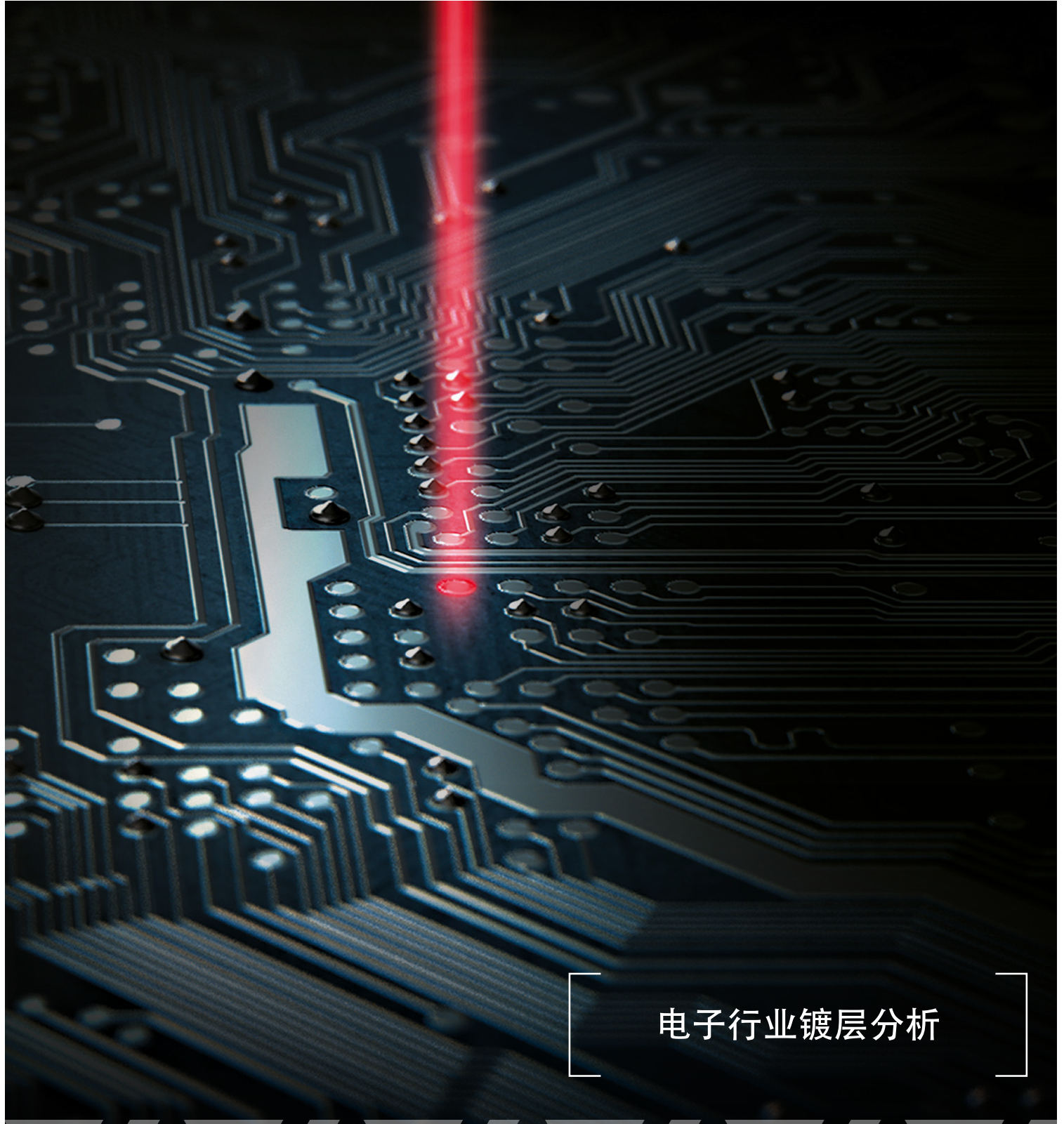


HITACHI
Inspire the Next

日立

每一纳米定成败



电子行业镀层分析

每一纳米都举足轻重

凭借我们45年为各行各业提供镀层分析解决方案的丰富经验，无论您分析何种样品或者挑战新的应用，我们的产品都将为您提供准确可靠的测量结果。

我们生产高精度、准确可靠的分析仪，以满足质量要求，确保符合行业规范。鉴于电子产品在汽车、航空航天、通信和消费品设备等市场中的关键作用，在生产和质量控制中的可靠性、准确性对设备安全性至关重要。我们的镀层测厚仪系列非常适合高端电子和半导体晶片工业，可测量小于100微米区域上的纳米级镀层。

为未来的小型化产品提供精准分析

您所选择的XRF分析仪对您的业务成败有着举足轻重的作用。您希望对今天有效且对明天的运营不会过时的技术进行投入。我们的XRF系列能提供长期解决方案，确保在小型化电子产品中得到精确一致的镀层。

日立分析仪器将高性能和可靠性相结合，致力于简化最复杂的操作。为了提高您的生产力，我们设计了简单易用的尖端技术。我们提供高度灵活的选项：

- | 多种样品舱和样品台配置，便于放置各种形状和尺寸的样品。
- | 可编程自动化，以节省操作员的时间。
- | 数据处理，包括导出后可以整合到质量管理体系或客户报告中。
- | 镀层分析以外的校准方案，包括RoHS筛选。

您业务的完美选择



不会过时

我们的分析仪拥有先进技术和为新应用重新配置的特性，是确保您始终拥有精良设备的长期正确投资。



可靠的高性能

当纳米对成败起着举足轻重的作用时，精确度和可靠性是至关重要。我们的解决方案能在提供高质量的同时最大限度地减少浪费和停机时间。



前沿技术

我们的产品为满足明天的需要而制造，包括高端毛细管聚焦光学元件和先进的检测技术，可轻松分析纳米级镀层。



性价比高

日立产品的性价比高。这些仪器按照严格的标准制造，最大限度地缩短了生产时间。



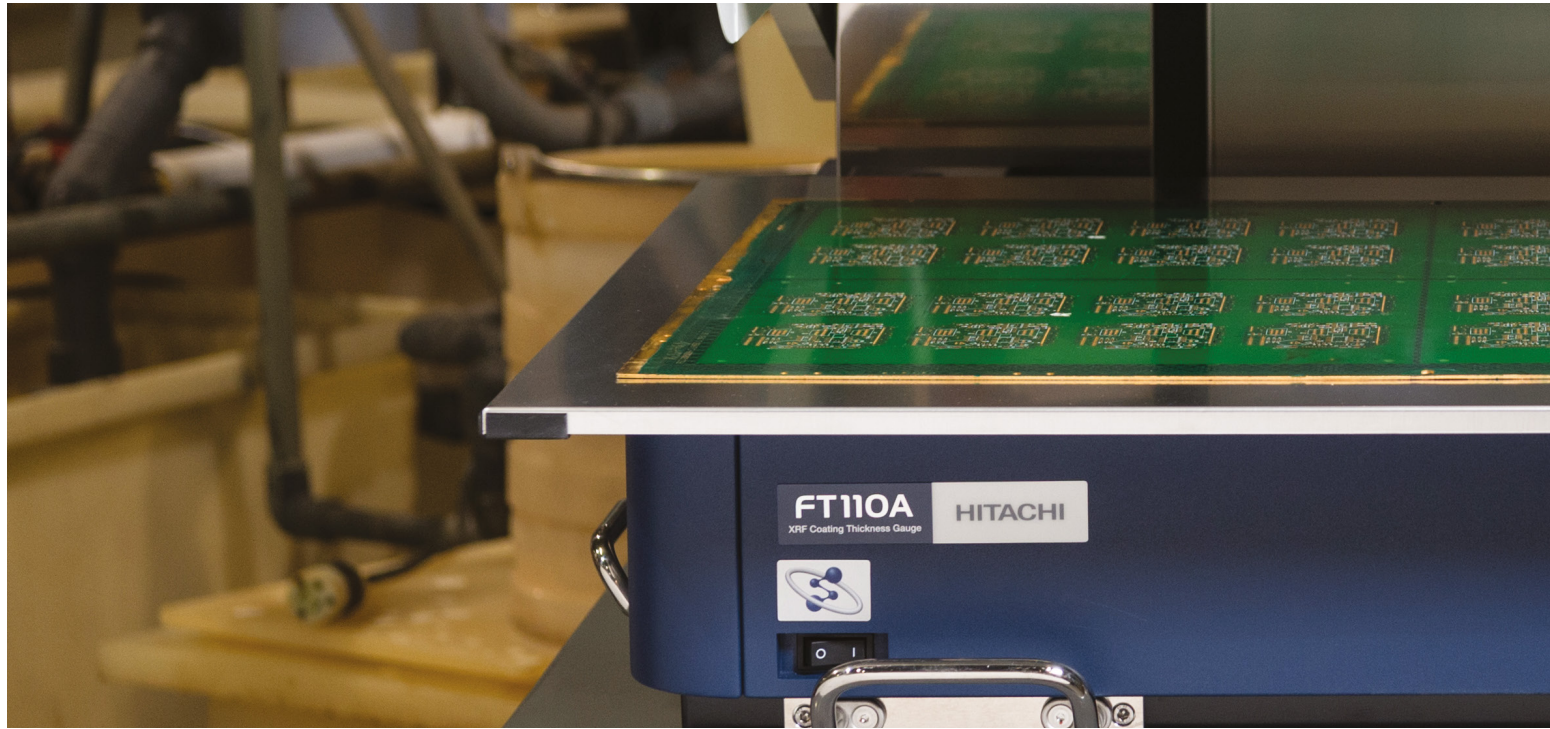
简单易用

我们的分析仪易于使用，只需要最少的用户培训，这意味着您可将资源集中在重要任务上。使用直观的屏幕菜单和程控自动样品测试，操作简单高效，极大地减少了人力成本和人为错误。



持续支持

不断提供技术支持服务是我们工作的重要组成部分。我们提供快速及时、价格合理的技术支持解决方案，以避免生产延迟和不必要的停机。



微型电子器件的微焦斑分析：FT150

这款不会过时的仪器专为微焦斑和超薄镀层分析而设计，可应对日益小型化的电子行业的挑战。

FT150可提供：

- | 毛细管聚焦光学元件和Vortex®X射线荧光SDD检测器。
- | 小于100 μm 的样品测量
- | 卓越的性能，以满足半导体晶片技术的挑战。
- | 快速得到结果，使用简单，以提高生产力。
- | 加快样品呈现速度的宽大样品舱门和样品台。
- | 进行测试监控的宽大样品观察窗。



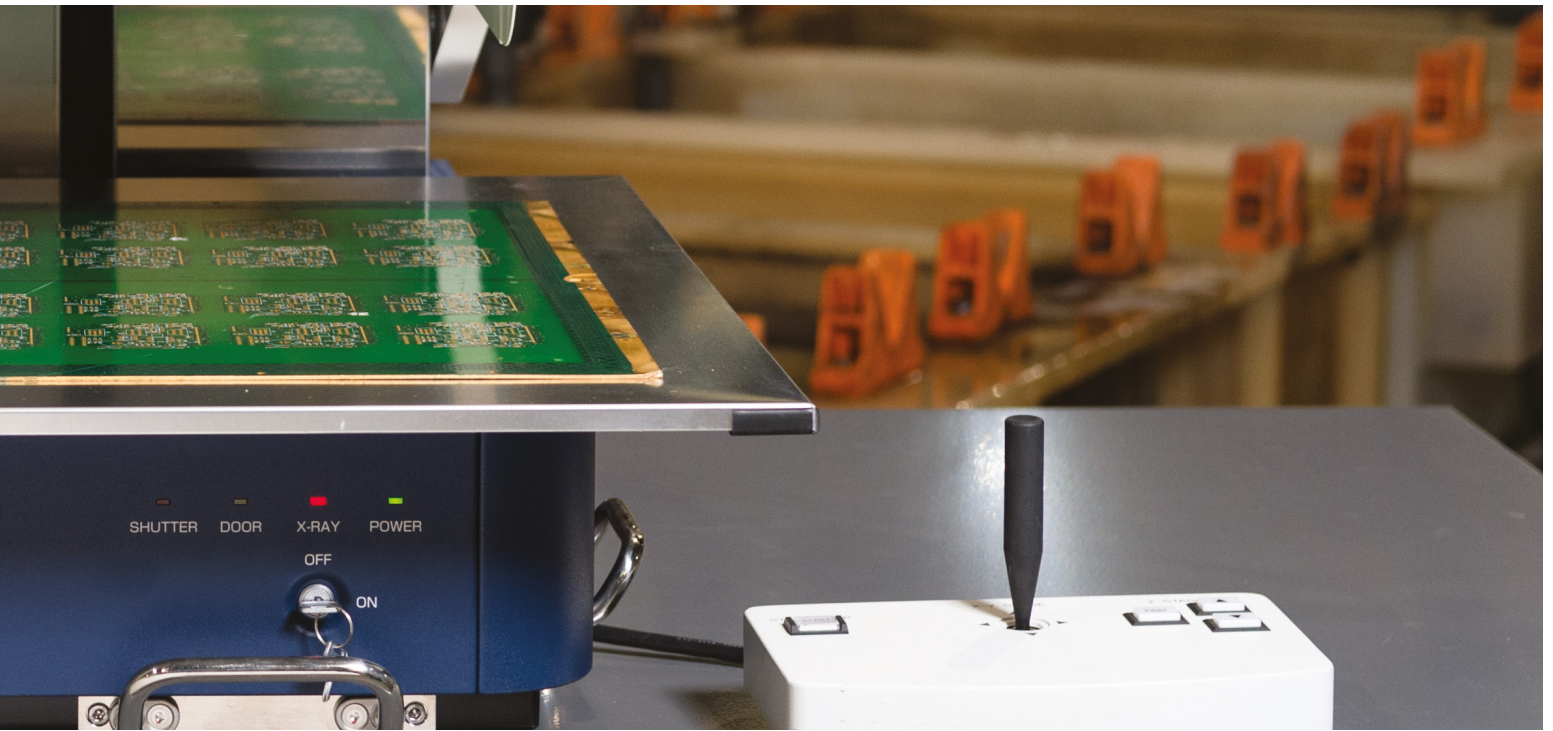
灵活适用于任何形状样品：X-STRATA920

X-STRATA920专门为分析各种形状和尺寸的样品而设计，可测量数百种应用，包括PCB表面镀层、连接器镀层等。

X-STRATA920可提供：

- | 提供复杂镀层分析的高分辨率SDD选项。
- | 适合任何形状样品的四种配置。
- | 适用于小型或平面型的样品的开槽的样品舱。
- | 可选的加深样品舱，用于测量较高的部件。
- | 可选的程控样品台，可编程单一PCB上各个位置的多点自动测量。
- | 使用可追踪标准优化校准方案，以确保完全准确的结果。





适用于较大样品的功能强大的XRF：FT110A

这种先进的XRF分析仪专为容纳大型样品而设计，使用方便，并提供快速准确的结果。

FT110A具有：

- | 可选双摄像头，可实现广角观察，并能更轻松地进行定位。
- | 自动化的样品对焦，以提高效率和易用性。
- | 可同时进行测试的层数多达四层，外加基材。
- | 最低限度的培训要求。
- | 快速准确的结果。



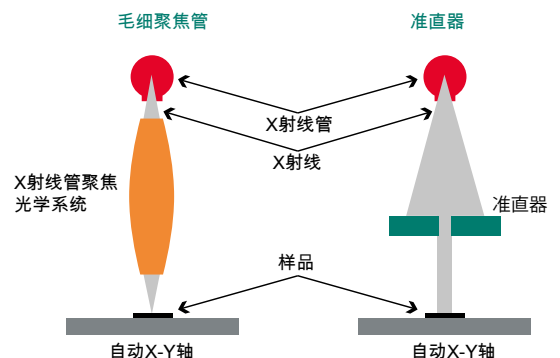
在两种先进技术之间进行选择，以测量电子和电子元件中的较小特征：

毛细聚焦管：

- | 强大的聚焦光学适合分析小于100 μ m的特征。
- | 高精度纳米级镀层分析提高分析效率。
- | 适用于未来操作的设计，满足将来小型化配件分析。

准直器：

- | 多个尺寸选项可用于单个仪器，以达到每个特征的最佳精度。
- | 圆形或矩形形状，以最好地匹配您的零件。
- | 灵活的配置，完全可以测量小到100 μ m的特征。



我们的镀层测厚仪系列

这些简单的手持式和台式镀层测厚仪使用涡流或微电阻技术来测量接触点上的镀层厚度。它们非常适合测量印刷电路板上的铜层。



CMI 760系列

单台设备即可测量面铜和孔铜。

主要功能：

- | 双重技术 — 涡流和微电阻。
- | 表面和通孔探针。
- | 动态统计显示
- | 可选探针转换



CMI 511系列

用温度补偿测量孔铜镀层厚度。

主要功能：

- | 通过温度补偿，可对刚从电镀池中取出的样品进行准确测量。
- | 蚀刻前或蚀刻后测量。
- | 工厂校准



CMI 165系列

适用于温度补偿的表面测量和铜线铜层厚度测量。

主要功能：

- | 耐用设计
- | 专有的SRP-T1可更换探针头。
- | 便于定位的照明探针头。

我们的服务

日立分析仪器的全球服务中心网络可提供全方位技术支持，确保您的仪器保持正常运行。



技术服务台

无论您何时遇到问题，我们都随时为您提供帮助。



在线诊断

通过我们的网站提供深入和快速的支持。



培训

帮助您充分利用分析仪及其全部功能。



延长保修期

给您额外的安心，避免意外的花费。



维修服务

我们通过服务协议提供快速高效的维修服务、重新认证和维护，以确保您的分析仪处于良好状态，避免任何额外的费用。



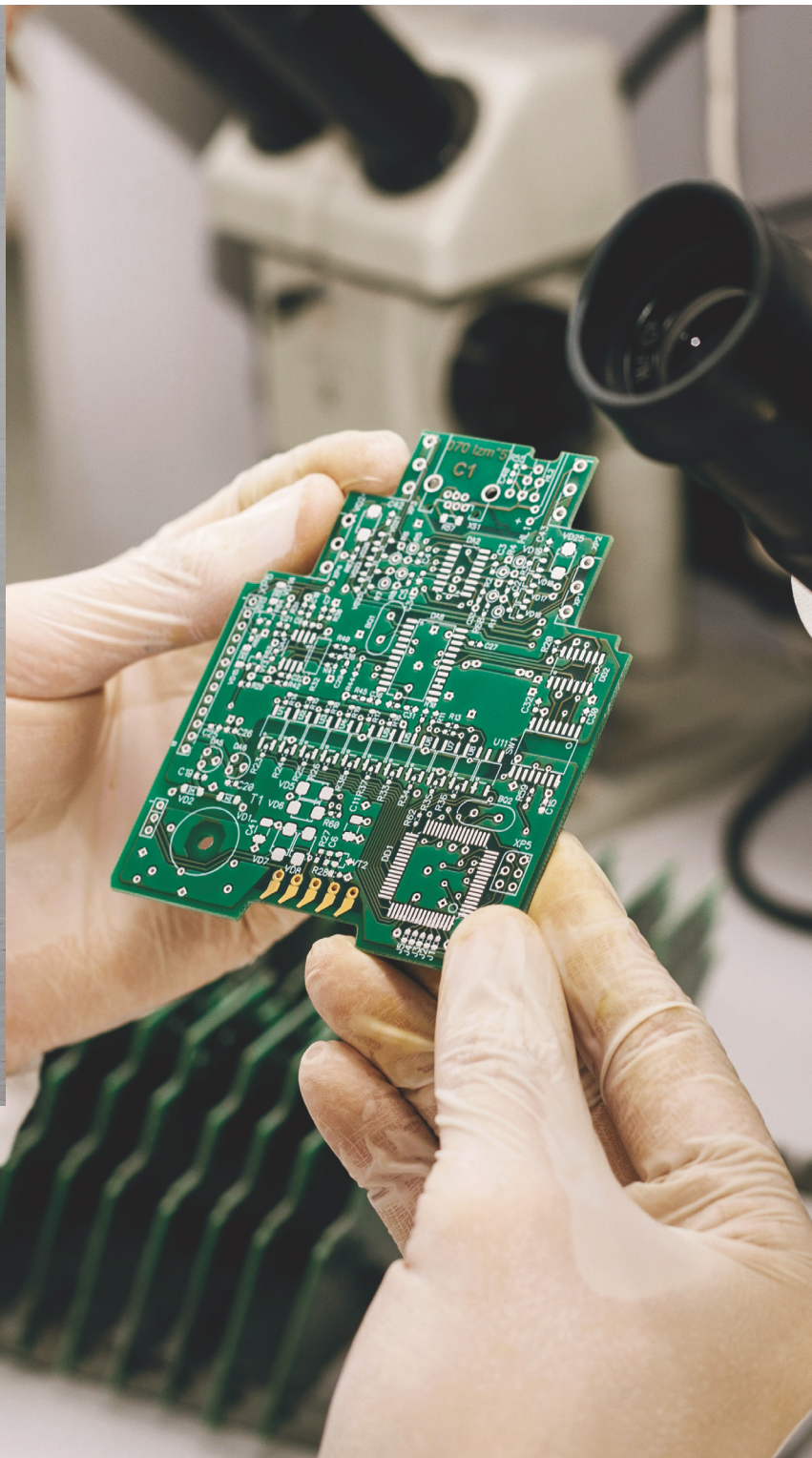
贵国或地区可能需要接受使用X射线设备方面的基本安全培训。

为什么选择我们？

作为45年的镀层分析解决方案的专家，我们设计了准确、快速、可靠、不会过时的产品，以应对当今和未来电子行业的挑战。我们的全球服务中心网络和技术支持确保最大限度地延长正常运行时间。

我们的内部专家一直在开发产品，以提高客户的生产效率并简化其操作。我们的产品是强大、可靠、尖端解决方案，可以应对企业面临的复杂挑战。

我们致力于确保您不仅能获得当前最佳的解决方案，而且还能为您的未来做出正确的投资。



下一步

请通过 contact@hitachi-hightech-as.com 联系我们的专家之一，安排进行演示。

更多信息

如需了解更多有关我们镀层测厚仪的信息，请访问网站：hhtas.net/electronics

销售热线：400 621 5191

Hitachi High-Tech Analytical Science

本出版物仅提供概要信息，版权归日立分析仪器所有。未经公司的书面许可，任何人不得以任何目的使用、应用或复制本出版物，或将其用于任何订单或合同。本出版物不可用作产品或服务相关说明。日立分析仪器的政策将持续改进。公司保留更改任何产品或服务的规格、设计或供货条件的权利，恕不另行通知。

日立分析仪器承认所有商标和注册。

©日立分析仪器，2018。保留所有权利。

 Science for a better tomorrow



348399 QM08

CERT #3397.01